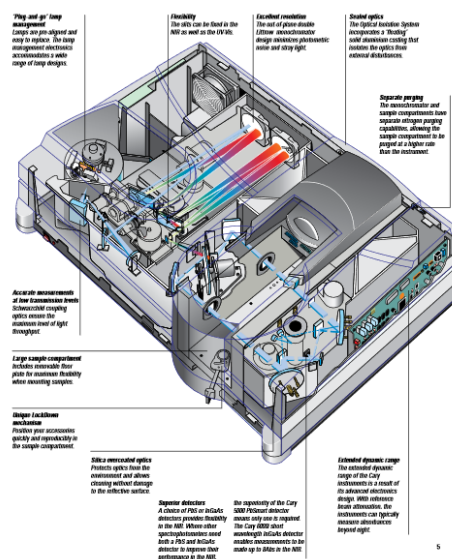


Spectrophotomètre / spectrophotomètre CARY 5000 UV-VIS-NIR

Dispositif UV-Vis-NIR, à haute performance photométrique, contrôlé par logiciel modulaire Cary WinUV. Il est équipé d'un compartiment échantillon élargi, pouvant contenir et inter-changer des accessoires destinés à la mesure de réflectivité spéculaire et diffuse, ou de support échantillons solide ou liquide, pour des mesures de transmittances.

Caractéristiques :

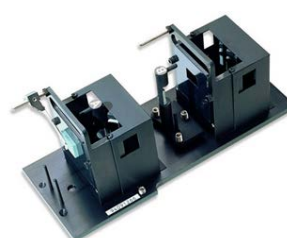
- *lampe*: Deutérium, Tungstène, Mercure
- *Gamme spectrale* : 175nm-3µm
- *Monochromateur* : double, 1200 tr/mm (UV, Vis)
300tr/mm (NIR)
- *Bande passante (nm)* : variable, 0.01 à 5nm (UV/Vis)
0.04 à 20nm (NIR)
- *Détecteur*: PMT R928UV Vis, PdS proche IR
- *Résolution UV Vis* : <0.048 UV Vis, 0.2 proche IR
- *Taux de lumière parasite* : <0.00007%T
à 220nm 10g/L KCl
- *Taux de lumière parasite* : <0.00002%T
à 1420nm H₂O, TO 1cm
- *Taux de lumière parasite* : <0.00045%T
à 2365nm CHCl₃, TO 1cm
- *Précision en longueur d'onde* : ±0.080nm UV Vis
±0.4nm Proche IR
- *Reproductibilité en* : ≤0.005nm UV Vis
longueur d'onde ≤0.02NIR (10 mesures)
- *Stabilité photométrique* : ≤0.00018Abs/hr
- *Bruit photométrique* : <0.00003 à 0 Abs à 500nm
<0.0001 à 2 Abs à 500nm



Le porte-échantillon solide est conçu pour les mesures de transmission de filtres, de verre, de textiles et d'autres échantillons solides lors de l'utilisation des spectrophotomètres UV-Vis-NIR. Il est fixé aux rails optiques, ce qui permet de positionner l'échantillon n'importe où dans le faisceau, en fonction de l'épaisseur de l'échantillon.

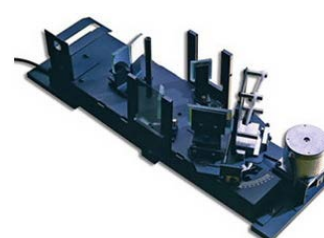


Sphère d'intégration conçue avec deux positions de mesures :
-D : Spéculaire exclue 0°/D
-S : Spéculaire incluse 3° 20'/D
Cet accessoire permet des mesures relatives de réflexions diffuses, totales et spéculaires par calcul. Mais également des mesures en transmission et absolues avec étalon, à partir d'échantillons liquides, solides et poudres.



L'accessoire de réflectance spéculaire VW est conçu pour mesurer la réflectance de type miroir sur des surfaces d'échantillons. Ses applications comprennent la détermination du degré de polissage d'une surface optique et la mesure de l'épaisseur de film de couches minces.

La technique de rebond unique est utilisée pour un débit de lumière maximal pour mesurer des échantillons à très faible réflectance tels que les revêtements antireflet. Les données sont corrigées pour la contribution du miroir au signal.



L'accessoire de réflectance spéculaire à angle variable (VASRA) mesure la réflectance à des angles compris entre 20° et 70° degrés. Le VASRA comporte un mécanisme de traduction d'échantillon qui éclaire la même partie de l'échantillon de sorte que ses mesures sont comparées à différents angles d'incidence.